

Low-Temperature Optical Investigation of the Urbach Tail in Amorphous  $Ge_x Te_{1-x}$  Alloys in the light of the Anderson model.

دراسات في درجات الحرارة المنخفضة لزيل يورباك في خلائط الجermanium - تيليريوم غير المتببور (الأمورف)  $a$ -  $Ge_x Te_{1-x}$  من خلال نموذج أندرسون .

#### Abstract

الدكتور  
عدنان ميني  
كلية العلوم

إن نموذج أندرسون في التركيب الإلكتروني يتطلب بتشكيل حالات طاقية متوضعة مزدوجة معزولة بواسطة تأثيرات متبادلة للإلكترون فونون . نريد أن نظهر في هذا البحث بأن تفسير الامتصاص الضوئي في منطقة زيل يورباك ، متوافق تماماً مع تغيرات حافة  $band$  المسبيّة من تواجد حقل كهربائي عشوائي مترافق مع هذه البيبولارون  $bipolarons$  . تنشأ عن انتقال الإلكتروني بين الروابط الحرة للتيليريوم  $Te$  عندما  $x = 0.33$  والروابط الحرة للجرمانيوم  $Ge$  عندما  $x = 0.33$  .



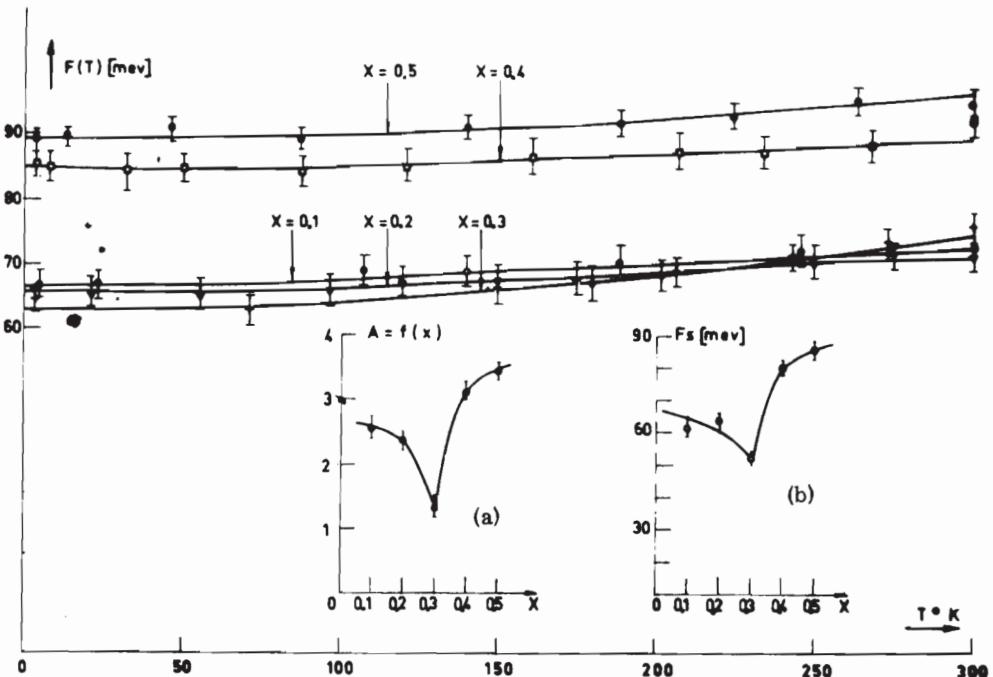


FIG. 3.  $F(T)$  for  $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$ . Inset (a),  $A(x)$ ; inset (b),  $F_s(x)$ .

### مقدمة

لقد قدم أندرسون مذجأً من أجل التركيب البنوي الإلكتروني لأنصار التوافق في حالة الكالكوجينور أمور لتفسير النقص في إشارات الـ EPR وفي مغناطيسية كيوري الطردية وفي حالة امتصاص ضوئي كبير معزى إلى كثافة كبيرة من مرتبة  $10^{19}$   $\text{Cm}^{-3}$  حالات طاقية متوضعة لازمة من أجل ثبيت مستوى فيرمي fermi.

لقد أظهر أندرسون بشكل مقنع بأن هذه الحالات الطاقية المتوضعة يجب أن تكون مشغولة بعدد مزدوج من الاليكترونات من خلال تأثيرات قوية متبادلة بين الاليكترون والفونون تتغلب على قوى الدفع الكولومبية .

بوجب أندرسون فإن هذه الحالات المزدوجة يجب أن تتحقق بها الصفات التالية :

- ١ - أنها لا تسبب في نشوء الحالة الاعتيادية للنقلية الكهربائية .
- ٢ - لاتعطي امتصاصاً ضوئياً أصغر من عرض عصابات الطاقة المنوعة .
- ٣ - لا تجيب على حقل مغناطيسي خارجي أيضاً .

وهكذا من أجل كل هدف وغرض فإن هذه الحالات البيبولارونية هي غير مرئية .  
ونحن هنا نقترح في هذه النشرة العلمية بأن دراسة زيل يورباك في المواد الغير متبلورة amorphes يمكن أن تقدم لنا فحصاً مباشراً لنموذج أندرسون بالإضافة إلى أن هذه الدراسة هي مساهمة قيمة لفهم الحالات الطافية المتوضعة في الكالكوجينور .  
من أجل أن تكون آلية غمزوج أندرسون فعالة فإن الاليكترون يتم انتقاله من رابطة حرة من «dangling bond» إلى رابطة أخرى .

في هذه العملية الرابطة الحرية الغير مشغولة تصبح مشحونة إيجابياً والرابطة التي تتلقى الاليكترونين من سبين spin مضاد تصبح مشحونة سلبياً .  
وهكذا بوجب هذا يتبع لدينا ترتيب من الشحنات الكهراکدة الايجابية والسلبية المتوزعة عشوائياً ، والنصف الناقل العديم التبلور هذا يشبه نصف ناقل متبلور معوض مشوب بشكل كبير (HDCCS) .

highly doped Compensated Crystalline Semiconductor

وفي هذا الخصوص ، إن غمزوج أندرسون مشتق من النماذج السابقة ② لأن الصاف النواقل المعادلة والمشابهة لتي استخدمت في أنصاف النواقل غير المتبلورة ، ولكن وجود اختلاف في الحقول الكهراکدة العشوائية وسيكون لدينا تشوهات استقطابية موضعية متطابقة مرکزة مسؤولة عن حالة ازدواجية الاستقطاب (بيبولارونية) . يتوقف عدد الحالات القطبية الموجبة والسلبية الناتجة عن الروابط الحرية للاليكترونات المنفردة بشكل كبير على انعدام شكل رباعي السطوح .

يبدو الآن واضحاً من أجل خلائق الجرمانيوم - تيليريوم  $Ge_x - Te_{1-x}$  غير المتبلور «الأمور» بأن هذا التنسيق المثالي لرباعي السطوح قد تم في حالة التركيب  $GeTe_2$  وذلك عندما ذرات الجرمانيوم Ge والتيليريوم Te تبقى على الترتيب رباعية وثنائية التكافؤ من أجل  $x = 0.33$  ④ في كل طرف من أطراف  $x = 0.5$  ، سوف نتوقع إيجاد ازدياد في عدد الحالات القطبية «الزوجية» .

بشكل تخططي في الشكل رقم (1) يظهر ما يمكن توقعه من مثل ذلك الاعتبار البسيط . وفي ملحق الشكل (1) نرى أن أحد التوقعات يمكن أن يكون التأثير على عصابات الناقلة وعصابات التكافؤ هذه الحالات القطبية الناتجة عن كلاً من الحقل الكهراکدي الداخلي والتشوه القطبي المحلي . وهكذا فإن البيبولارونات «غير مرئية» يجب أن تؤثر بعمق

على حجم حواف العصابات ، وبناء على ذلك ، فإن دراسة متابعة لزيل يورباك URBACH TAIL بتابعية نسبة تركيب الخليطة يجب أن تكون على قدر من الأهمية .

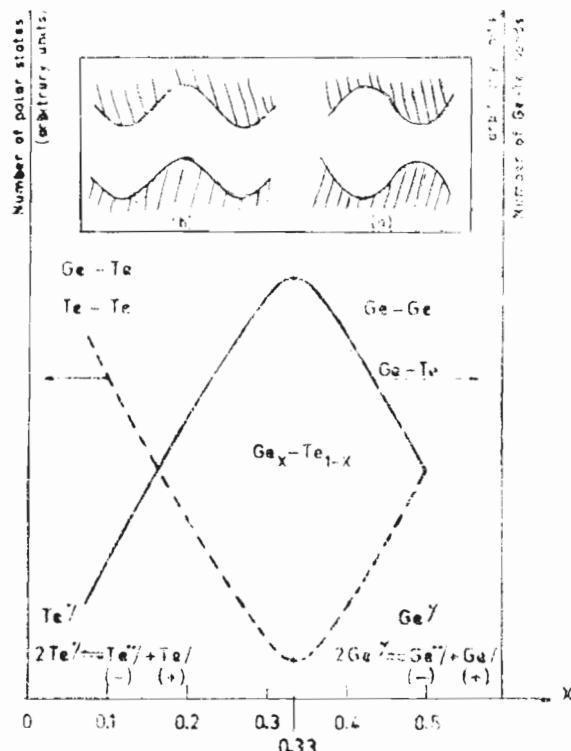


FIG. 1. Schematic variation of the number of Ge-Te bonds and polar states with  $x$ . Inset: band edge with (a) deformation potential and (b) electrostatic potential.

طرق تحضير العينات والأجهزة المستعملة :  
 إن الصفائح الرقيقة لخلانط الجermanيوم - تيليرسون  $Ge_x - Te_{1-x}$  قد حضرت بواسطة طريقة الرش SPUTTERING من درية من  $Ge_x - Te_{1-x}$  حيث أن  $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$  وذلك على صفائح من السيليس ضمن جهاز مخل من الهواء حتى يوجد ضغط جزئي من الأرغون مقداره  $5 \times 10^{-3}$  Torr .  
 إن قياس عامل الامتصاص الضوئي قد أجري بواسطة سبيكتروفوتوميتر ذي حزمتين

ضوئيتين مجهز بموشور Beckman DK2A Spectrophotometre . هذا الجهاز يؤمن لنا حزمة ضوئية وحيدة اللون متصلة بين ٢٠، ٣ ميكرون و ٣ ميكرون .

لقد استخدمنا كريوسنات ذي حزمتين ضوئيتين متناسبة مع السبيكتروفوتوميتر وذلك لنستطيع تغيير درجة الحرارة من درجة الحرارة الطبيعية K 300 و حتى درجة حرارة الهيليوم السائل K ٤ خلال إجراء قياساتنا للنافذية الضوئية T .

إن قيم عامل الامتصاص الضوئي  $\alpha$  بتابعية طاقة الفوتون  $\text{M}^{-1}$  قد حسبت من قياس النافذية الضوئية T فقط على كل عينة من العينات<sup>(6)</sup> من أجل كل قيمة لـ  $\alpha$  فقد أجرينا القياسات على عدة عينات مختلفة السماكة تتراوح بين ٧، ١٠، ٣ ميكرون و ٣ ميكرون . هذه القيم  $\alpha$  تتوافق تماماً في درجة الحرارة العادية K 300 مع القيم المحسوبة من قياس النافذية الضوئية T والانعكاس الضوئي R لنفس العينات في نتائج سابقة<sup>(5)</sup>

من أجل خطأ تجاري في قياسنا للنافذية الضوئية % 0.25  $T = \alpha + 25\text{Cm}^{-1}$  حيث أن  $\alpha$  هي سماكة العينة .  
نحصل على نوعين من التغيرات حسب نسبة تركيب الخلية . من أجل  $0.3\text{Cm}^{-1}$  ، فإن عامل الامتصاص الضوئي  $\alpha$  يتغير بشكل أسي مع طاقة الفوتون وذلك من أجل قيم

$\alpha = 10^4\text{Cm}^{-1}$   
إن منحنياتنا للتغيرات  $\alpha$  في درجات الحرارة الاعتيادية بتابعية طاقة الفوتون تتوافق بشكل ممتاز مع نفس المنحنيات للباحثين HOWARD TSU<sup>(7)</sup> و BAHL CHOPRA<sup>(7)</sup> و نفس المنحنيات للباحثين<sup>(7)</sup> نتائج القياسات :

من أجل  $0.3\text{Cm}^{-1}$  فإن الشكل (2) يبين تغيرات  $\alpha$  بتابعية طاقة الفوتون وذلك من أجل خمسة قيم لدرجات الحرارة بين K 300 و K 20 للخلية  $\text{Ge}_{0.1} - \text{Te}_{0.9}$  .

إن عامل الامتصاص الضوئي  $\alpha$  يتغير بشكل أسي مع طاقة الفوتون من أجل  $5 \times 10^2\text{Cm}^{-2}$  : أما من أجل  $5 \times 10^4\text{Cm}^{-1}$  فإن قيم  $\alpha$  هي أكبر من القيم المطابقة لامتداد الجزء الأسي «على شكل خط مستقيم» .

يمكن تجزئته إلى جزء أول يمثل امتداد الجزء الأسي (الخط المخطط في الشكل 2) وإلى جزء ثان لا يتوقف على درجة الحرارة (الخط--- في الشكل 2) .

إن الجزء الثاني الذي لا يتوقف على درجة الحرارة يحافظ دائماً بنفس المظاهر لتغير

الامتصاص  $\alpha$  بمتابعة طاقة الفوتون  $h\nu$  من أجل جميع نسب الخلطة  $x$  ، ولكن شدتها تتناقص حتى الاختفاء من أجل  $x = 0.1$  و حتى  $x = 0.3$  .

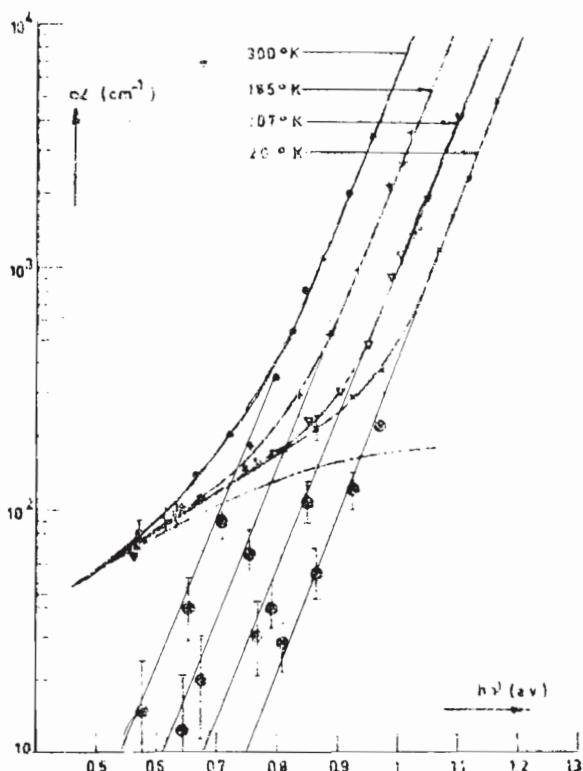


FIG. 2.  $\alpha$  versus  $h\nu$  at some temperatures for  $x = 0.1$ .

إن الشكل (3) يظهر تغيرات  $F(T)$  الموجود في العلاقة  $\alpha = \alpha_0 e^{-p} \frac{h\nu - h\nu_0}{F(T)}$  بدلالة درجة الحرارة  $T$  من أجل مختلف نسب التركيب .

إن تغيرات  $F$  بدلالة  $x$  هي كبيرة جداً . ولكن نلاحظ أيضاً ازدياد بسيط لـ  $F$  بازدياد درجة الحرارة  $T$  والتي سعتها تتغير بمتابعة نسب التركيب .

إن زيل يورباك في تفسيره الأكثر شمولاً<sup>8</sup> يغزى إلى حقل كهربائي ميكروني داخلي ينبعث سواءً من شحنات متوضعة (HDCCS) ، أو من فوتونات ضوئية  $W_0$  (في البلورات الشاردية) .

يمكنا كباقي الباحثين ⑨ تفكيك  $F_{(T)}$  إلى جزئين :

$$F_{(T)} = F_s + \frac{\hbar \omega_0}{2A} \operatorname{Coth} \frac{\hbar \omega_0}{2kT} \quad (1)$$

حيث أن  $F_s$  هو جزء بنيوي مستقل عن درجة الحرارة وأما الحد الثاني  $\frac{\hbar \omega_0}{2A} \operatorname{Coth} \frac{\hbar \omega_0}{2kT}$  يحوي ثابتة الأزدواجية  $A$  حيث  $A \geq 1$  والمعروفة إلى الحقل الكهربائي الناجم عن الفوتونات الضوئية .

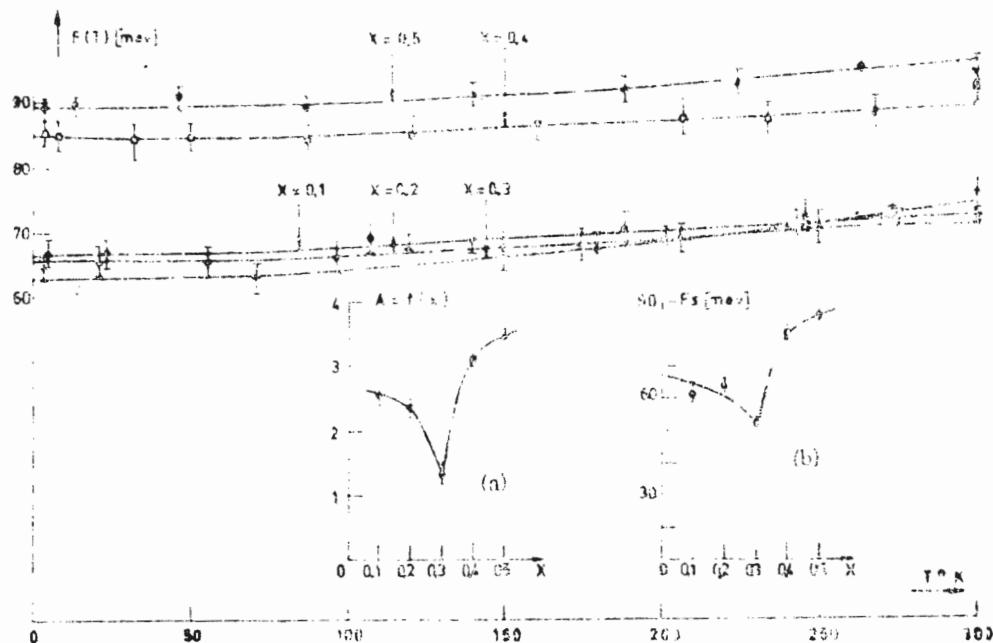


FIG. 3.  $F(T)$  for  $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$ . Inset (a),  $A(x)$ ; inset (b),  $F_s(x)$ .

من أجل خلائط الـ  $\text{Ge}_x\text{Te}_{1-x}$  فإن طيف الفوتون قد درس بواسطة الأشعة فوق الحمراء ومفعول رaman ، ولقد وجدت عدة خصائص للترددات مستقلة عن نسب التركيب في هذه الخلطية مع وجود امتصاص للأشعة فوق الحمراء سائد من أجل  $W = 220 \text{ Cm}$  ناجمة عن الرابطة ④.  $\text{Ge}-\text{Te}$

من أجل كل مركب من مركبات الـ  $\text{Ge}_x\text{Te}_{1-x}$  يمكن ايجاد كل من  $A$  و  $F_s$  وهكذا فإن النقاط التجريبية التي حصلنا عليها تتوافق مع القيم النظرية في العلاقة (1) والممثلة في الشكل بالخط المتصل .

إن تغيرات  $A$  وتغيرات  $F_s$  مع  $x$  تظهر في ملحق الشكل (3).

على ضوء هذه النتائج ، يمكننا الرجوع قليلاً إلى تفسير المخطط في الشكل<sup>(1)</sup> .

## ١ - الترابط الكيميائي وروابط Ge-Te

إذا قيست قوة الرابطة بعرض عصبات الطاقة المنوعة Gap (القاب) للمواد المقابلة  
فان رابطة الـ Ge- Te تساوي  $1.2\text{eV}$  في الـ  $\text{Ge Te}_2$  (التي  $\text{Ge}-\text{Ge}$  أقوى من الرابطة  $0.87\text{eV}$ )  
تساوي تقريباً  $1\text{eV}$  أو أقوى من الرابطة  $\text{Te}-\text{Te}$  (التي تساوي  $0.87\text{eV}$ ) إذن من أجل كل  
قيمة  $L^x$  ، سيظهر عدد أعظمي من روابط الـ  $\text{Ge}-\text{Te}$  .  
من أجل  $\langle L^x \rangle$  سيكون لدينا روابط  $\text{Te}-\text{Te}$  وروابط  $\text{Ge}-\text{Te}$  بينما من أجل  $L^{0.3}$   
سيكون لدينا روابط  $\text{Ge}-\text{Ge}$  وروابط  $\text{Te}-\text{Te}$  .

هذه الصورة تتوافق مع قياسات الأشعة فوق الحمراء وقياسات الرامان ④ وتتوافق أيضاً مع سلوكية بلورات الـ  $\text{Te}_{1-x}\text{Ge}_x$  غير المتبلور (الأمورف) خلال التسخين ⑪ طبقاً لهذا فإن تغيرات عدد روابط الـ  $\text{Ge}-\text{Te}$  مبينة (بالخط الأسود المتصل) في الشكل ⑪. هذا ينعكس في تغيرات  $A$  (ازدواجية بين الـ  $\text{Ge}-\text{Te}$  وروابط الفوتوتان) وفي القيمة الصغرى لـ  $A$  من أجل  $x = 0.3$  [الملحق (a) من الشكل ③] المساوية 1.3 قريبة جداً من القيمة المثالية ⑫ (A = 1) عندما كل الروابط الموجودة تقرباً هي روابط  $\text{Ge}-\text{Te}$ .

## ٢- الحالات القطبية POLAR STATES

ن torque ظهور التشوهات القطبية المحلية LOCAL POLAR DEFORMATION بشكل أكثر في الروابط Te-Te, Ge-Ge, Gx-Gx من [في الملحق (b)] في الشكل (3) لخلائط الـ  $x$  بدلالة  $x$  مع وجود قيمة اصغرية من أجل  $x = 0.3$  متوافق تماماً مع المخطط في الشكل رقم (1). يتزايد على كل من جانبي  $x = 0.33$  مع عدد الحالات القطبية الناشيء من الـ Te (في حالة  $x < 0.33$ ) ومن الـ Ge (في حالة  $x > 0.33$ ) (ممثل في الخط الساند المخطط بالضفتين عندما تزداد الشوائب، في حالة (HDCCS) 12]

٣ - التعدياCompensation,

إن التشوهات القطبية المحلية تنشأ عن انتقال اليكترون بين رابطتين حرتين كما هو في نموذج أندرسون . إن التغيرات الناتجة معنا لميل زيل يورباك بدلالة درجة الحرارة  $T$  مقارنة نتائج الدراسة على  $HDCCS$  [  $F_{(t)}$  هو ثابت من أجل المواد المعدلة ] ، فان  $F_{(t)}$  يتغير بشكل درجة الحرارة من أجل المواد الغير معدلة ] تشير من أجل كل التراكيب درجة عالية من التعديل مع وجود ناقلة كهربائية صافية  $Compensation$  .  $conductirte intrinseque$  (35)

إذن ، في كل الحالات التعديل تماماً بدقة . من أجل  $x \leq 0.3$  نجد مركبة امتصاص لفوتونات ذات طاقة صغيرة مستقلة عن درجة الحرارة تعزى عادة إلى ثغرات الشبكة البلورية defect في روابط الكالكوجينور ⑨

بعد الاضاءة ، هذا النوع من الاشارة يزداد بشكل كبير مع ظهور اشارات صغيرة من الـ RPE<sup>13</sup> وهكذا يمكن أن يعزى بشكل أدق إلى كثافة قليلة من روابط حرة من اليكترونات وحيدة للتيليريوم Te . نلاحظ هذا فقط من أجل  $x > 0.33$  ، وكتافتها تزداد مع كمية التيليريوم Te .

من أجل  $x < 0.33$  فان المادة تصبح تعادلية COVALANT أكثر فأكثر ، إذن فإن التشوّهات اللازمة لخلق حالات قطبية تصبح أكبر فأكبر . هذا يترك عدد من الروابط الحرّة الفردية المتزايدة مع معطية ناقليّة كهربائيّة مشوّبة Extrinsic Conductivité متزايدة مع  $x$  في حالة  $x < 0.5$  ⑤ وفي الحالة الحدية للجرمانيوم النقي Ge فإنه ينتج ناقليّة كهربائيّة مشوّبة . لقد عرضنا في هذا البحث نتائج تجريبية لامتصاص الضوئي في منطقة زيل يورباك في درجات الحرارة المنخفضة في الكالكوجينور الغير المتببور «أمورف» في الجermanium - تيليريوم من أجل  $x < 0.5$  .

لقد بينا بأن نموذج أندرسون المتضمن حقله الكهربائي العشوائي الداخلي المستعمل في حقل الروابط الحرّة يتتطابق بشكل منسجم مع معطياتنا التجريبية .

هذا البحث كان من ضمن الأبحاث التي قمت بها في مركز البحوث الوطنية الفرنسية (CNRS) في غرونوبل - فرنسا

وقد نشر في مجلة Physical Review letters في المجلد 37 العدد 5 عام 1976 بالاشتراك مع

A.DENEUVILLE

. B.K.CHAKRAVERTY

# المراجع العلمية

- <sup>1</sup>P. W. Anderson, Phys. Rev. Lett. 34, 1346 (1975).
- <sup>2</sup>H. Cohen, J. Non-Cryst. Solids 4, 391 (1970); J. D. Dow and J. J. Hopfield, J. Non-Cryst. Solids 5-10, 664 (1972).
- <sup>3</sup>H. K. Roelstad and J. P. de Neufville, in *Proceedings of the Eleventh International Conference on the Physics of Semiconductors, Warsaw, 1972*, edited by The Polish Academy of Science (PWN—Polish Scientific Publisher, Warsaw, 1973), p. 423.
- <sup>4</sup>G. B. Fisher, J. Tauc, and Y. Verchelle, in *Proceedings of the Fifth International Conference on Amorphous and Liquid Semiconductors, Karlsruhe-Partenkirchen, West Germany, 1974*, edited by J. Stuke and W. Brügel (Taylor and Francis, London, 1975), p. 1259.
- <sup>5</sup>A. Deneuville, J. P. Keradec, P. Gérard, and A. Minni, Solid State Commun. 14, 341 (1974).
- <sup>6</sup>J. P. Keradec and A. Deneuville, to be published.
- <sup>7</sup>W. E. Howard and R. Tsu, Phys. Rev. B 1, 4705 (1970); S. K. Bahl and K. L. Chopra, J. Appl. Phys. 40, 4940 (1969).
- <sup>8</sup>J. J. Dow and D. Redfield, Phys. Rev. 123, 1530 (1971).
- <sup>9</sup>J. Cornet and D. Rossier, Philos. Mag. 27, 1335 (1973); R. A. Street, T. M. Searles, I. G. Austin, and R. S. Sussman, J. Phys. C 7, 1582 (1974).
- <sup>10</sup>J. Stuke, J. Non-Cryst. Solids 4, 1 (1970).
- <sup>11</sup>A. Deneuville, P. Gérard, and J. Davenyi, to be published.
- <sup>12</sup>J. R. Dixon and I. N. EHHS, Phys. Rev. 123, 1560 (1971); A. B. Fowler, W. E. Howard, and G. E. Broch, Phys. Rev. 128, 1434 (1962); J. F. Farkev, Phys. Rev. 140, 2059 (1965); D. Redfield and H. Aframowitz, Appl. Phys. Lett. 11, 138 (1967).
- <sup>13</sup>S. G. Bishop, V. Strom, and P. C. Taylor, Phys. Rev. Lett. 32, 1346 (1973).